产品信息

3D 表面测量　MarSurf　WI 100

物品号：　**6355002**

技术数据

分辨率	最大 0.2 (nm) 垂直
测量速度	最高 140 fps
测量原理	白光干涉仪 高功率 LED（650 nm / 白色）
其他	xyz 方向碰撞检测
电源	100 - 240 V
表面参数	ISO 4287、ISO 13565、ISO 25178…
重量	0 KG

产品特征

可自动化的高端测量系统

MarSurf WI 100 M 是一台强大的白光干涉仪，用于表面的三维测量和分析 # **非接触，与材料无关，而且速度快**。

全方位的测量解决方案，始终保持灵活性，精确到亚纳米级：这就是全新 MarSurf WI 100 的特点。这些高精度测量
用于研究和质量保证的工具可提供可靠的 3D 测量数据 - 仅需几步即可快速、直观地完成。

额外的手动 Z 轴定位、大 x 和 y 轴行程范围以及能够实现自动化，使其有优异的易用性。可以执行不依赖用户的、完全自动化的测量，使此表面测量系统非常适合质量保证中对简单直接和高效率的要求。

主要优势：

使用自动化软件进行与用户无关的系列测量
高测量速度 # 即使是在全分辨率下
用户友好的概念
全方向碰撞检测保证了您的工件和测量系统的安全
高动态范围 (HDR) 功能，16 位
高清拼接：大尺寸测量表面的高分辨率输出一致

这种成熟的光学测量系统可成功用于：

DIN EN ISO 4287 / 25178 标准的粗糙度测量
表面特征轮廓测量（包括体积、磨损、各向同性）
微观几何形状和层厚的测量

用户非常重视该测量系统的可靠性，因为它是为很多行业提供了可定量、可追溯的 **3D 特征的可靠测量系统** 。

应用

机械制造
鉴定和量化粗糙度、几何形状和磨损体积

电子系统和半导体
亚纳米级组件检测，保证产品无故障

医疗技术
生产和实验室中医疗表面的质量保证

材料科学
新产品表面的功能性特征优化

微系统技术
以纳米级精度测量最小组件的复